## Влияние у-облучения на электрические свойства CuGaSe<sub>2</sub>

© И. Касумоглу, Т.Г. Керимова<sup>¶</sup>, И.А. Мамедова

Институт физики Национальной академии наук Азербайджана, AZ-1143 Баку, Азербайджан

(Получена 30 марта 2010 г. Принята к печати 22 апреля 2010 г.)

Исследовано влияние  $\gamma$ -облучения на проводимость низкоомных ( $10^2-10^4\,\mathrm{Om\cdot cm}$ ) и высокоомных ( $10^5-10^7\,\mathrm{Om\cdot cm}$ ) монокристаллов CuGaSe<sub>2</sub> в интервале температур 77—330 К. Обнаружено, что удельное сопротивление низкоомных образцов увеличивается с увеличением дозы  $\gamma$ -облучения, а высокоомных образцов практически не зависит от дозы облучения. Предполагается, что уменьшение проводимости в низкоомных образцах происходит за счет рассеяния свободных носителей на дефектах (заряженных центрах), созданных при облучении  $\gamma$ -квантами. Обнаружено, что доза  $\gamma$ -облучения не влияет на температурную зависимость удельного сопротивления низкоомных и высокоомных образцов в интервале 77—330 К.

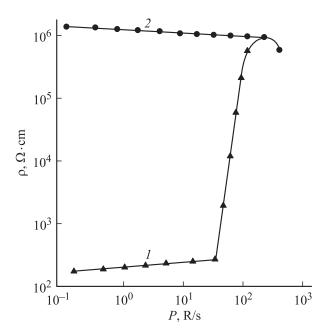
Интерес к полупроводниковым соединениям типа  $A^{I}B^{III}C_{2}^{VI}$  — тройным аналогам бинарных полупроводников A<sup>II</sup>B<sup>VI</sup> — обусловлен перспективностью использования их в полупроводниковом приборостроении. Эти соединения являются оптически анизотропными, в них наблюдается явление двойного лучепреломления [1], которое может быть использовано в нелинейных оптических преобразователях. С другой стороны, эти соединения, кристаллизующиеся в структуре халькопирита, зарекомендовали себя как перспективные материалы для использования при создании солнечных преобразователей, а также при создании тонкопленочных гетеропереходов [2,3]. Показано, что гетероструктуры Zn-Cu(In,Ga)Se<sub>4</sub> можно использовать в качестве высокоэффективных фотопреобразователей естественного и линейно поляризованного излучения [2]. Исследования влияния у-облучения на фотопреобразователи ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> показали, что при комнатной температуре у-облучение не влияет на фотоэлектрические параметры гетероструктур [3]. Последнее обстоятельство позволяет использовать их в условиях высокого радиационного фона. Поэтому изучение влияния различных внешних факторов на физические свойства соединений  $A^IB^{III}C_2^{VI}$  является актуальным.

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования влияния  $\gamma$ -облучения на электрические свойства монокристаллов CuGaSe<sub>2</sub>.

Для проведения исследований были получены методом химических транспортных реакций монокристаллы CuGaSe2. В качестве транспортера использовался кристаллический йод. Соединение CuGaSe2 кристаллизуется в структуре халькопирита (пр. гр.  $D_{2d}^{12}$ ). Параметры решетки определены рентгенографически:  $a=5.607\,\text{Å},\ c=10.99\,\text{Å},\ c/a=1.96$ . Полученные монокристаллы были p-типа проводимости. Для проведения измерений удельного сопротивления на естественные грани образцов наносились контакты из эвтектического сплава  $\ln + \mathrm{Ga}$ . Удельное сопротивление выращенных монокристаллов изменялось в широких пределах ( $\rho=10^2-10^7\,\mathrm{Om\cdot cm}$ ). Образцы для исследования были разделены на две группы: низкоомные ( $\rho=10^2-10^4\,\mathrm{Om\cdot cm}$  при 300 K) и высокоомные

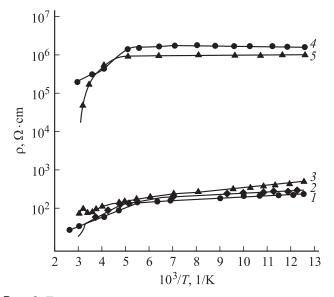
 $(\rho=10^5-10^7\,{\rm OM\cdot cm}$  при 300 K). В качестве источника  $\gamma$ -излучения использовался  $^{60}{\rm Co}$  с энергией квантов 1.25 МэВ. Интенсивность  $\gamma$ -излучения варьировалась от 0.1 до 500 P/с. Образцы охлаждались до температуры жидкого азота и после этого подвергались  $\gamma$ -облучению при определенной мощности дозы в течение 3 мин. Через 5 мин после прекращения облучения измерялись удельное сопротивление и его температурная зависимость. Эксперимент повторялся при различных мощностях дозы  $\gamma$ -облучения. При измерениях образцы тщательно экранировались от света.

На рис. 1 представлены зависимости удельного сопротивления низкоомного (кривая I) и высокоомного (кривая 2) образцов CuGaSe<sub>2</sub> от интенсивности  $\gamma$ -облучения (P) при 77 К. Из рис. 1 видно, что удельное сопротивление высокоомного образца с увеличением дозы  $\gamma$ -облучения незначительно уменьшается. Зависимость удельного сопротивления низкоомного образца CuGaSe<sub>2</sub>

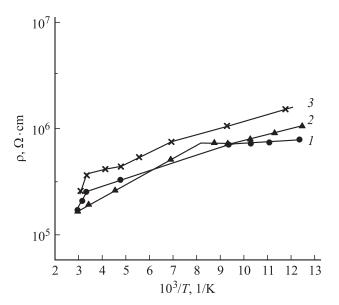


**Рис. 1.** Зависимости удельного сопротивления низкоомного (I) и высокоомного (2) образцов CuGaSe<sub>2</sub> от мощности дозы  $\gamma$ -облучения при 77 K.

<sup>¶</sup> E-mail: ktaira@physics.ab.az



**Рис. 2.** Температурные зависимости удельного сопротивления низкоомных образцов CuGaSe $_2$  — исходного (I) и подвергнутого  $\gamma$ -облучению различной интенсивности: 20 (2), 50 (3), 100 (4), 300 P/c (5).



**Рис. 3.** Температурные зависимости удельного сопротивления высокоомных образцов  $CuGaSe_2$  — исходного (1) и подвергнутых  $\gamma$ -облучению интенсивности 80 (2), 20 P/c (3).

в зависимости от дозы  $\gamma$ -облучения носит другой характер. При увеличении мощности дозы  $\gamma$ -облучения до 40 P/c удельное сопротивление незначительно увеличивается, а в интервале 40-300 P/c удельное сопротивление увеличивается от  $3\cdot 10^2$  до  $8\cdot 10^5$  Ом · см. Значение удельного сопротивления низкоомного образца при 500 P/c совпадает со значением удельного сопротивления высокоомного образца. В [4] установлена корреляция между характером изменения электропроводности и шириной запрещенной зоны. В частности, для широкозонных полупроводников характерным является переход

из низкоомного состояния в высокоомное. Облучение кристаллов приводит к образованию радиационных дефектов в виде вакансий, межузельных атомов, а также различного типа комплексов дефектов, взаимодействующих между собой и с химическими примесями. В [5] показано, что при облучении кристаллов радиационные дефекты приводят к самокомпенсации и проводимость полупроводника стремится к собственной. При облучении у-квантами в монокристаллах p-CuGaSe<sub>2</sub> образуются радиационные дефекты донорного типа, которые компенсируют акцепторные примесные центры (удельное сопротивление изменяется от  $3 \cdot 10^2$  до  $8 \cdot 10^5$  Ом · см). В итоге уровень Ферми смещается к середине запрещенной зоны. Мощность дозы 40 Р/с является критической, при которой удельное сопротивление CuGaSe<sub>2</sub> начинает расти. При дальнейшем увеличении дозы у-квантов количество радиационных дефектов, увеличиваясь, приводит к уменьшению подвижности и, следовательно, к увеличению удельного сопротивления. Полупроводник из низкоомного состояния переходит в высокоомное.

Исследования температурной зависимости облученных и необлученных образцов p-CuGaSe $_2$  (рис. 2 и 3) показали, что температура незначительно влияет на проводимость и, следовательно, на основе монокристаллов CuGaSe $_2$  можно создавать радиационно-стойкие полупроводниковые приборы.

## Список литературы

- [1] D.C. Chemla, P.J. Kupecek, D.C. Robertson, R.C. Smith. Optics Commun., 3, 29 (1971).
- [2] В.Ф. Гременок, Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, ФТП, 39 (2), 218 (2005).
- [3] В.В. Емцев, Ю.А. Николаев, Д.С. Полоскин, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, М.В. Якушев. ФТП, 39 (12), 1455 (2005).
- [4] В.Л. Винецкий, Л.С. Смирнов. ФТП, 1 (5), 176 (1971).
- [5] Н.В. Агринская, Т.В. Машовец. ФТП, 28 (9), 1505 (1994).

Редактор Л.В. Шаронова

## The influence of $\gamma$ -radiation on electrical properties of CuGaSe<sub>2</sub>

I. Kasumoglu, T.G. Kerimova, I.A. Mamedova Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan, AZ-1143 Baku, Azerbaijan

**Abstract** It was investigated the influence of  $\gamma$ -radiation on low-resistance  $(10^2-10^4~\Omega~cm)$  and high-resistance  $(10^5-10^7~\Omega~cm)$  CuGaSe2 single crystals in 77–300 K temperature interval. It was revealed, that the resistivity of low-resistance samples increases with increase of the  $\gamma$ -radiation doze, the resistivity of high-resistance samples does not depend on the radiation doze. It is supposed, that decrease of conductivity in the low-resistance samples is due to scattering of carriers on defects (charged centers) generated under radiation with  $\gamma$ -quanta. It was revealed that  $\gamma$ -radiation does not influence on temperature dependence of the low-resistance and the high-resistance samples in 77–300 K temperature range.